

# Chapitre 1 : Les semi-conducteurs

## 1. Introduction: conducteurs et semi-conducteurs

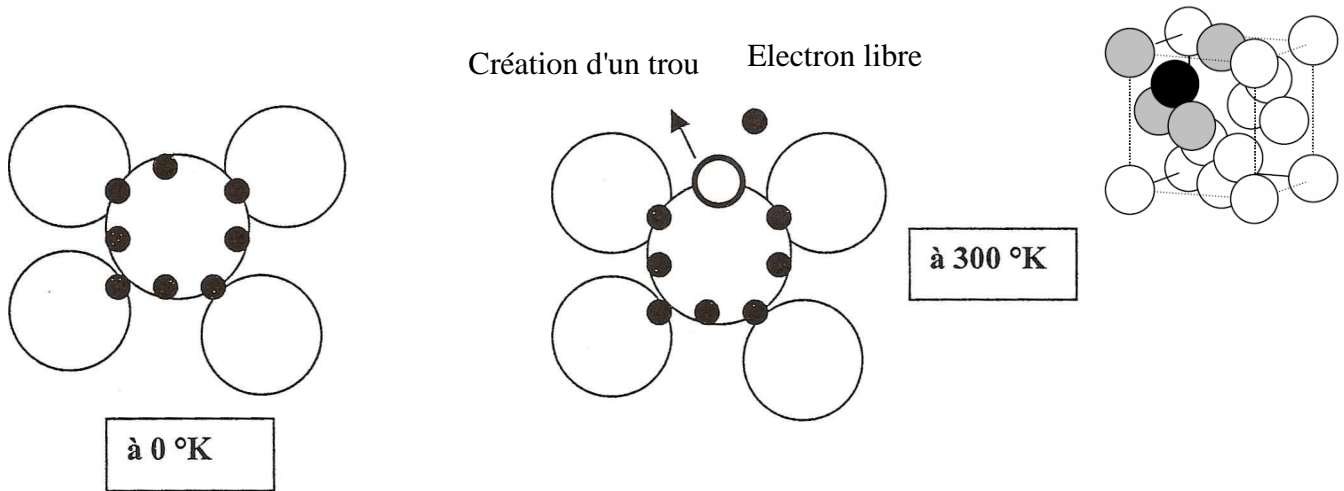
### 1.1 Les conducteurs:

- ~ conductivité qui décroît avec la température T (augmentation des collisions)
- ~ densité élevée de porteurs libres (de charge), exemple: métaux du groupe I

### 1.2 Les semi-conducteurs intrinsèques (parfaits):

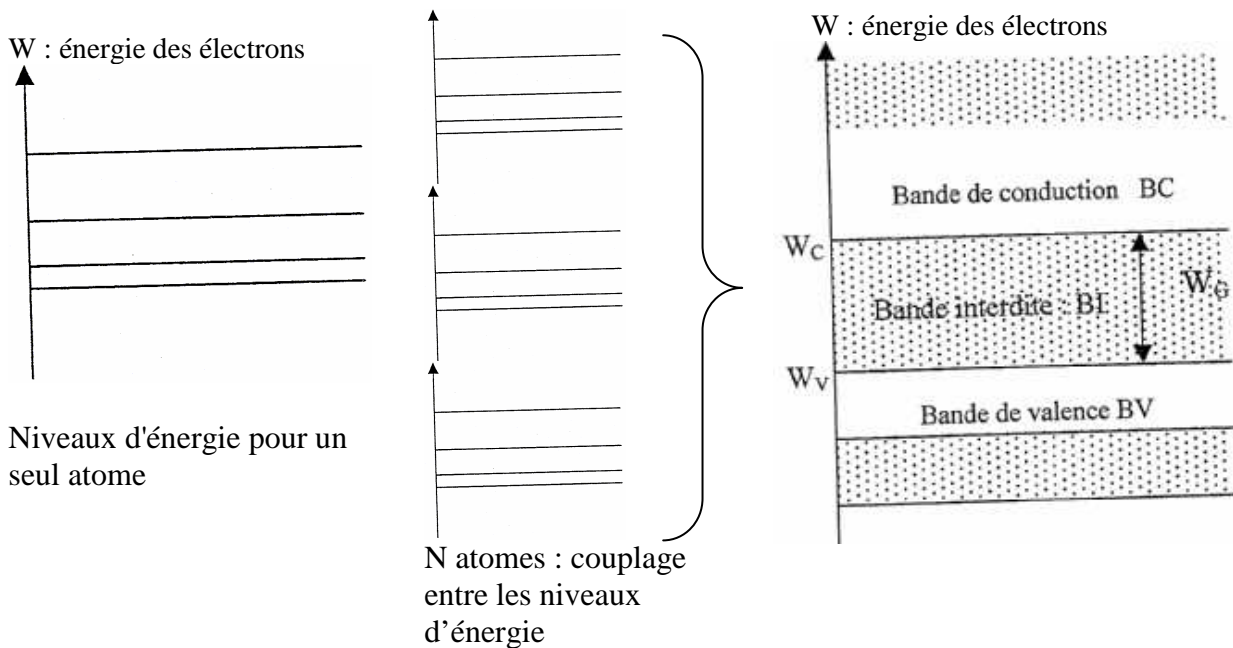
- ~ isolants à 0 K et faiblement conducteurs à 300 K
- ~ conductivité qui augmente avec la température T (augmentation du nombre d'électrons libres)

⇒ Si, Ge : éléments du groupe IV  
(tétravalent – 4 liens covalent)

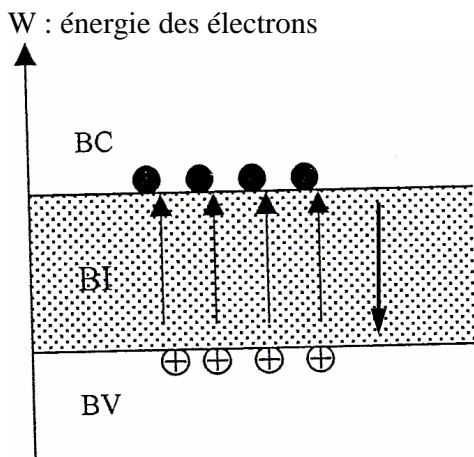


## 2. Introduction: structure de bande des semi-conducteurs intrinsèques

### 2.1 Le modèle de bande



## 2.2 Les phénomènes de génération-recombinaison



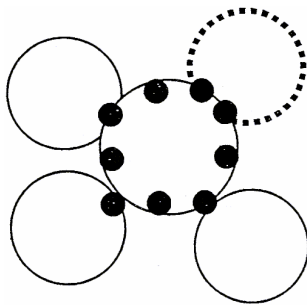
Création (génération) et destruction (recombinaison) de paire électron/trou lors du passage d'un électron de la BV à la BC ou réciproquement.

- électrons
- ⊕ trous

## 3. Semi-conducteurs extrinsèques et semi-conducteurs composés

### 3.1 Principe du dopage

Manque un électron :  
Création d'un trou dans la BV

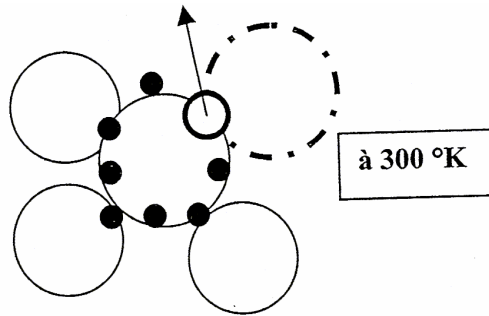


1 Atome du groupe V →  
1 électron de plus dans la BC

Atomes du groupe V : As, Bi, P  
sont des atomes donneurs



$N_D$  donneurs à  $T= 300K$  →  
 $N_D$  électrons dans la BC



1 Atome du groupe III →  
1 trou de plus dans la BV

Atomes du groupe III : B, Al, In  
sont des atomes accepteurs



$N_A$  accepteurs à  $T= 300K$  →  
 $N_A$  trous dans la BV

### 3.2 Les composés semi-conducteurs

Principe : à 300 K la couche externe est saturée

~ composés III-V: AsGa, InSb

~ composés II-VI: CdS, ZnS, CdSe, ZnSe, ....

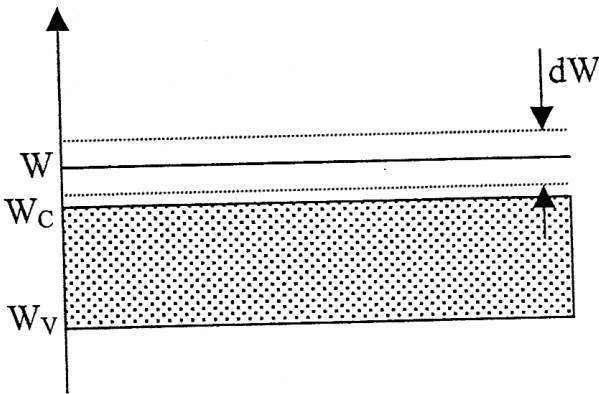
Propriétés du Silicium et de l'arséniure de gallium:

Paramètre:	Ge	Si	GaAs
Largeur de la BI $W_G$ (eV)	0,66	1,12	1,42
Densité intrinsèque $n_i$ (cm <sup>-3</sup> )	$2,4 \cdot 10^{13}$	$1,45 \cdot 10^{10}$	$1,79 \cdot 10^6$
Densité d'états utiles dans la BC pour les électrons $N_C$ (cm <sup>-3</sup> )	$1 \cdot 10^{19}$	$2,7 \cdot 10^{19}$	$0,04 \cdot 10^{19}$
Densité d'états utiles dans la BV pour les trous $P_V$ (cm <sup>-3</sup> )	$0,5 \cdot 10^{19}$	$1,1 \cdot 10^{19}$	$1,3 \cdot 10^{19}$
resistivité intrinsèque $\rho_i = l/\sigma_i$ ( $\Omega$ cm)	47	$65 \cdot 10^3$	$38 \cdot 10^7$
Mobilité électron $\mu_n$ (cm <sup>2</sup> /Vs)	3900	1500	8500
Mobilité trou $\mu_p$ (cm <sup>2</sup> /Vs)	1900	450	400
Constante diélectrique relative $\epsilon_r$	16	11,9	13,1

#### 4. Densités $n$ d'électrons, $p$ de trous et position du niveau de Fermi

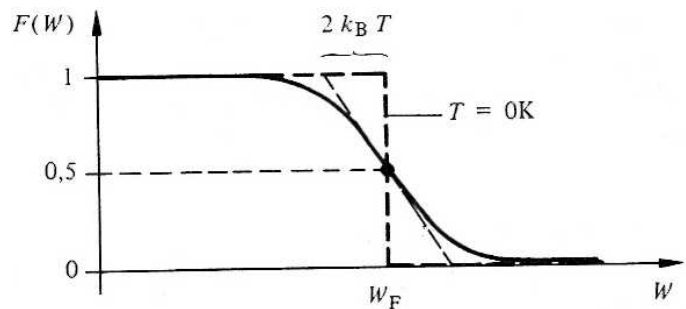
##### 4.1 Densité d'états d'énergie disponibles pour les électrons et les trous, Fonction de Fermi

$W$  : énergie des électrons



$$dn = Z(W) F(W) dW$$

$Z(W)$  : densité d'états disponibles sur niveau  $W$  de la BC  
Même type d'équations pour les trous de la BV



La fonction de Fermi-Dirac

$$F(W) = \frac{1}{1 + \exp(\{W - W_F\} / k_B T)}$$

$F(W)$  représente la probabilité pour un électron d'occuper un niveau  $W$

**Electron dans la BC pour semi-conducteur non dégénéré :**

(i.e.  $W - W_F \gg k_B T$ )

$$F(W) \approx \exp(-\{W - W_F\} / k_B T)$$

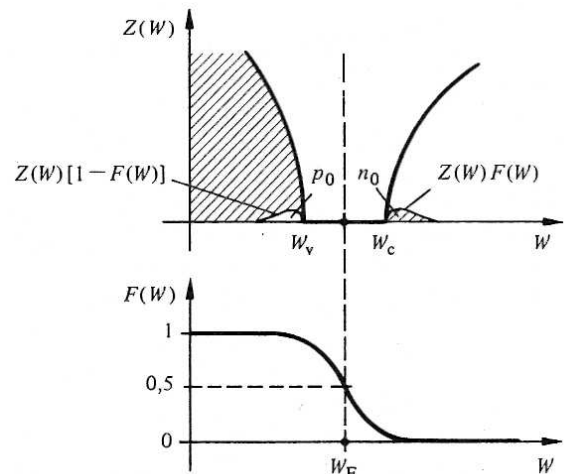
**Cas des trous dans la BV :**

$$\text{Probabilité } F^*(W) = 1 - F(W) \approx \exp(\{W - W_F\} / k_B T)$$

##### 4.2 Densité de porteurs (trous et électrons)

~ pour un semi-conducteur intrinsèque on a  $p_i = n_i$  avec la loi d'action de masse  $p \cdot n = n_i^2$

~ pour un semi-conducteur extrinsèque la loi d'action de masse est toujours valable mais les porteurs différents de ceux apportés par le dopant sont très minoritaires ( $p \ll n$  ou  $n \ll p$ )



### 4.3 Position du niveau de Fermi (voir TD 1)

~ pour tout semi-conducteur non dégénéré à l'équilibre on montre que:

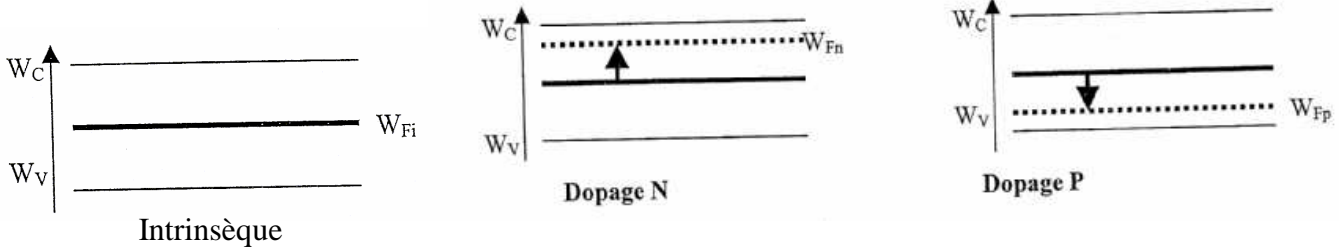
$$n = N_C \exp(-\{W_C - W_F\} / k_B T) \text{ et } p = P_V \exp(\{W_V - W_F\} / k_B T)$$

→ on montre alors que :

~ pour un semi-conducteur intrinsèque:  $W_{Fi} = (W_C + W_V) / 2$  ( $W_{Fi}$  est au centre de la B.I.)

~ pour un semi-conducteur extrinsèque type N:  $W_{Fn} = W_C - k_B T \ln(N_C / N_D)$

~ pour un semi-conducteur extrinsèque type P :  $W_{Fp} = W_V + k_B T \ln(P_V / N_A)$



## 5. Transport dans les semi-conducteurs

Dans un semi-conducteur l'accroissement des charges libres peut avoir trois origines : le phénomène de génération-recombinaison (négligé), l'arrivée de charge due à un champ électrique ou à la diffusion.

### 5.1 Effet d'un champ électrique et courant de dérive

exemple: courant dû aux électrons de la BC

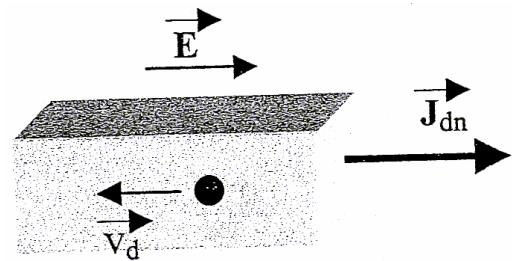
#### Expression de la densité de courant de dérive $J_d$

~ un électron contribue de  $-e \cdot v_d$  à la densité de courant

~ densité de courant : vecteur

- norme = |charge| traversant l'unité de surface pendant l'unité de temps

- sens : pour les électrons voir figure



~ densité de courant de dérive pour les électrons  $J_{dn}$  :

$$J_{dn} = -e \cdot n \cdot v_{dn} \text{ soit } J_{dn} = e \cdot n \cdot \mu_n \cdot E$$

~ on montre de même que la densité de courant de dérive dû aux trous  $J_{dp}$  s'écrit:

$$J_{dp} = +e \cdot p \cdot v_{dp} \text{ soit } J_{dp} = e \cdot p \cdot \mu_p \cdot E$$

~ densité totale de courant de dérive :  $J_d = (e \cdot n \cdot \mu_n + e \cdot p \cdot \mu_p) E$

### 5.2 Conductivité

La conductivité d'un semi-conducteur est donc  $\sigma = e \cdot n \cdot \mu_n + e \cdot p \cdot \mu_p$  (eq.5)

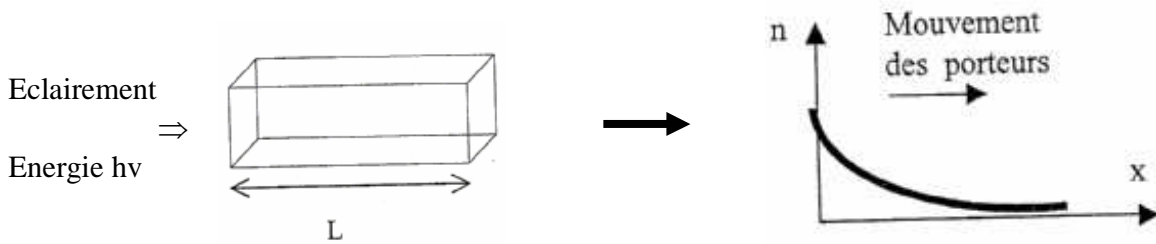
*semi-conducteur intrinsèque*:  $n = p = n_i$  et conductivité intrinsèque  $\sigma_i = e \cdot n_i \cdot (\mu_n + \mu_p)$

*semi-conducteur dopé  $n^+$*  :  $p \ll p_i$  et  $n \approx N_D$  donc  $\sigma_n = e \cdot N_D \cdot \mu_n$

*semi-conducteur dopé  $p^+$*  :  $n \ll n_i$  et  $p \approx N_A$  donc  $\sigma_p = e \cdot N_A \cdot \mu_p$

### 5.3 Effet d'un gradient de concentration et courant de diffusion

exemple: courant dû aux électrons de la BC



#### Origine du courant de diffusion

Dans un gradient de concentration le mouvement des porteurs s'effectue des régions à haute concentration vers les régions à basse concentration

#### Expression de la densité de courant de diffusion

→ Le flux d'électrons traversant la surface en  $x=L$  est

$\phi_n = -D_n \cdot [dn/dx]$  où  $D_n$  est la constante de diffusion (prend des valeurs positives)

donc la densité de courant de diffusion s'écrit:  $\mathbf{J}_{\text{dif},n} = e \cdot D_n \cdot [dn/dx] \cdot \mathbf{e}_x$  où  $\mathbf{e}_x$  est le vecteur unitaire porté par l'axe  $x$ .

→ Le flux de trous traversant la surface en  $x=L$  est

$\phi_p = -D_p \cdot [dp/dx]$

donc la densité de courant de diffusion s'écrit:  $\mathbf{J}_{\text{dif},p} = -e \cdot D_p \cdot [dp/dx] \cdot \mathbf{e}_x$  où  $\mathbf{e}_x$  est le vecteur unitaire porté par l'axe  $x$ .

### 5.4 Expressions des densités totales de courant

~ La densité totale de courant d'électrons due aux actions simultanées d'un champ électrique et d'un gradient de concentration s'écrit:

$$\mathbf{J}_n(x) = \mathbf{J}_{dn} + \mathbf{J}_{\text{dif},n} = e \cdot n(x) \cdot \mu_n \mathbf{E}_x + e \cdot D_n \cdot [dn/dx] \quad (\text{eq.7})$$

~ Similairement, le courant de trous est tel que:

$$\mathbf{J}_p(x) = \mathbf{J}_{dp} + \mathbf{J}_{\text{dif},p} = e \cdot p(x) \cdot \mu_p \mathbf{E}_x - e \cdot D_p \cdot [dp/dx] \quad (\text{eq.8})$$

### 5.4 Relations d'Einstein

Dans un semi-conducteur à l'équilibre thermodynamique les densités totales de courant sont nulles.

$$e \cdot n(x) \cdot \mu_n \mathbf{E}_x + e \cdot D_n \cdot [dn/dx] = 0$$

Or si on a un gradient de concentration on observe simultanément diffusion de porteur due au gradient de concentration et dérive des porteurs dans le champ interne  $E_{\text{int}}$  qui provient du potentiel interne  $V_{\text{int}}$ .

On a en fait :  $E_{\text{int}} = -[dV_{\text{int}}(x)/dx] = 1/e [dW_C(x)/dx] = 1/e [dW_C(x)/dn] [dn/dx]$

En utilisant les résultats de 4.3 on peut alors établir les relations d'Einstein qui lient les constantes de diffusion aux mobilités :

$$D_n / \mu_n = D_p / \mu_p = k_B T / e \quad (\text{eqs.10})$$